



X 光繞射儀

X-RAY DIFFRACTOMETER

-
- 儀器中文名稱：X 光繞射儀
 - 儀器英文名稱：X-RAY DIFFRACTOMETER
 - 儀器英文簡稱：XRD

- 儀器設備說明：

儀器購置年月：2019 年 11 月

廠牌及型號：Rigaku SmartLab SE

重要規格：最大電壓 60kV，最大電流 60mA。

低角度繞射量測。

智慧式實驗助理功能。

可執行 0D/1D/2D 掃描量測及定點照相。

儀器性能：粉體晶相鑑定。

薄膜晶相鑑定。

低掠角 X 光繞射量測。

殘餘應力分析。

- 服務項目：

一般服務：測量薄膜、粉末與多晶材料之 X 光繞射光譜。

特殊服務：經儀器指導教授認可並通過資格考試者可自行操作。

- 申請服務辦法：

一般服務：

- 申請自行操作者，必須先取得校方 3 小時輻射核可證明，合格後授予自行操作預約資格執照。

樣品準備需知：

- 晶體試片不可大於 2×2×0.2cm，亦不可太小。
- 不接受具揮發性與毒性、空氣中強反應性之試片之粉末試樣。
- 一律用公用電腦寄電子檔，將檢測數據帶回(為維護實驗室資安，不可使用自備隨身碟)。

●收費標準：請參考本系公用儀器收費相關資訊(<https://che.ntu.edu.tw/che/Fee.html>)



「鄭江樓貴儀儀器室」之「鄭江樓貴重儀器室儀器收費標準」(PDF 檔)。

●聯絡人：

儀器指導教授：康敦彥 教授

TEL：(02) 3366-1767

E-MAIL： dunyen@ntu.edu.tw
--

儀器管理員：王南惠

TEL：(02) 3366-1508

E-MAIL： wangnh@ntu.edu.tw
--

儀器教學助教：林羿萱

TEL：(02) 3366-3069

E-MAIL： f11524002@ntu.edu.tw
--

資料更新日期：2024.1.29